

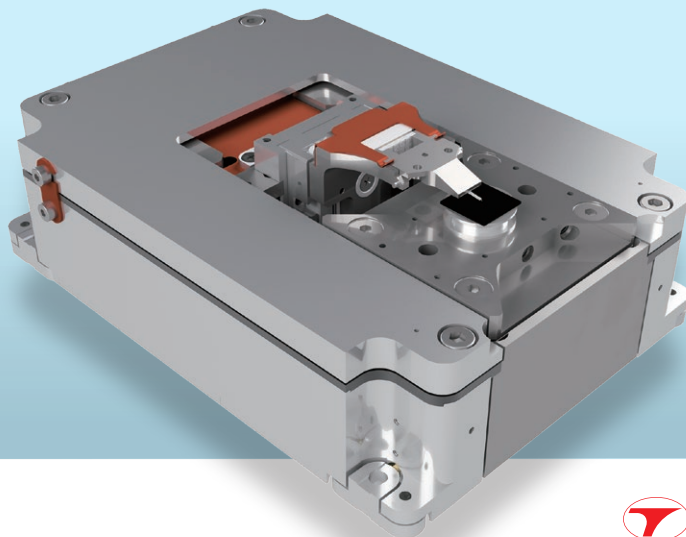


“はかる”技術で未来を創る

NenoVision 社製 SEM/FIB-SEM 搭載用 AFM

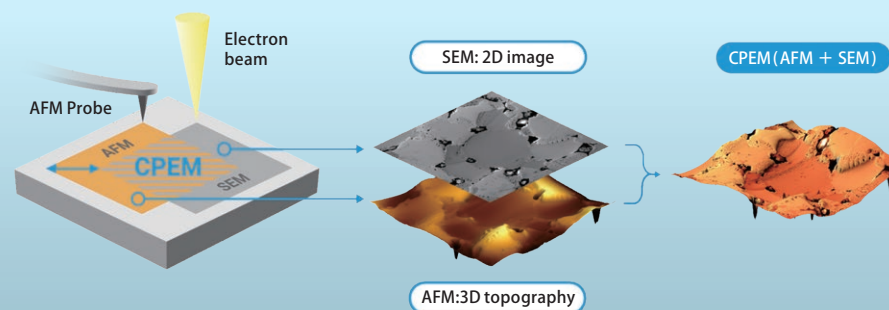
LiteScope 2.0

原子間力顕微鏡と走査電子顕微鏡を組み合わせた
新しい相関分析技術を提供



特長

- 同一箇所の SEM イメージングと AFM イメージングが同時かつ同環境下で実現
- 他の相関法に比べて非常に高い時間効率と相関位置精度
- AFM による微細な凹凸情報や物性情報を、SEM 像に重ね合わせ可能
- SEM イメージングにより関心領域への正確な AFM 探針のアプローチ
- SEM/FIB-SEM への搭載は容易で、すぐに使用可能



東陽テクニカ

www.toyo.co.jp/microscopy



NenoVision

株式会社 東陽テクニカ
ライフサイエンス&マテリアルズ
〒103-8284 東京都中央区八重洲 1-1-6
TEL.03-3279-0771 EE-Mail: bunseki@toyo.co.jp

大 阪 支 店	〒532-0003	大阪府大阪市淀川区宮原1-6-1 (新大阪ブリックビル)	TEL.06-6399-9771
名古屋営業所	〒460-0008	愛知県名古屋市中区栄2-3-1 (名古屋広小路ビルディング)	TEL.052-253-6271
宇都宮営業所	〒321-0953	栃木県宇都宮市東宿郷2-4-3 (宇都宮大塚ビル)	TEL.028-678-9117